



Contribution ID: 5

Type: **not specified**

## **Schichtdickenmessungen an Mehrschichtsystemen mittels Terahertz-Messtechnik**

*Thursday, September 15, 2016 11:20 AM (20 minutes)*

Fraunhofer IPM

**Presenter:** Dr JONUSCHEIT, Joachim (Fraunhofer IPM)